Search Notes			

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
09/867,058	BEYDA ET AL.
Examiner	Art Unit
Joseph T. Phan	2614

	SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		

,		<u> </u>			
-					
*,					
		,	• .		
	•				

INT	ERFERENC	E SEARCH	ED
Class	Subclass	Date	Examiner
		,	

SEARCH (INCLUDING SEAR	NOTE	S TRATEGY)
		DATE	EXMR
Updated East Search		12/26/2006	JTP
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
•			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	,		
· ·			